べき乗ガウス型分布族に基づく確率的劣化モデルと 形状関数の経験的推定に関する研究

Stochastic Degradation Models Based on the Family of Powered Inverse Gaussian Distributions and Empirical Estimation of the Shape Function

> 中央大学大学院 理工学研究科 経営システム工学専攻 長塚研究室 20N7100020H 伏原 卓哉

1 研究背景

物や製品は時間が経つことによって劣化が進み,品 質が低下することで故障が生じる.事前に故障を防ぐた めには対象物の寿命を予測し,適切なタイミングにお ける交換やメンテナンスを行うことが必要である.劣化 データは故障データに比べ1サンプルから多くのデー タが取得でき,近年 IoT の進歩やセンサリング技術の 向上によって取得できる機会が増えた.そのため,劣 化データに関する研究が近年盛んに進められており劣 化データに当てはめるためのモデル「劣化モデル」が 多く提案されている.

劣化は時間の経過により発生しランダム性を伴うた め確率過程 {Y(t); t > 0} によってモデル化され、Lévy 過程が劣化現象を説明するのによく用いられる. Lévy 過程に基づく劣化モデルは Wiener, Gamma, Inverse Gaussian (IG) 劣化モデル [1],[4],[7] などが該当するが 3つほどしかない. そのため, 観測時間が得られた下 で Lévy 過程である場合を考えることで多様なモデルを 考慮に入れることが可能となり、Generalized Inverse Gaussian (GIG) 劣化モデル [9] などが提案された. GIG 劣化モデルは Wiener, Gamma, IG 過程の尤度関数の 一般化になっているため劣化現象を表すモデルとして の妥当性を与えている. このように観測時間が得られ た下で Lévy 過程である劣化モデルを考え, 従来劣化モ デルの研究に用いられてきた分布を拡張した分布で劣 化モデルを構築することにより汎用的な劣化モデルに なるのではないかと考えられる.

そこで本研究の一つ目の提案として, IG 分布および GIG 分布に従う確率変数をべき乗変換して得られる一 般化分布である「Powered Inverse Gaussian (PIG) 分 布, Powered Generalized Inverse Gaussian (PGIG) 分 布の 2 つの分布に基づく劣化モデル」について提案す る. この提案は [2] にも掲載している.

次に、本研究の二つ目の提案として、劣化モデルにお ける形状関数の経験的推定に関する提案を行う.劣化モ デルの研究では形状関数 $\Lambda(t)$ をモデルに組み込むこと によって、増分の従う分布の時間による変化をなくし、 定常性を保つようにしており、 形状関数は $\Lambda(0) = 0$ となる単調非減少関数という性質を持つ. 形状関数は [10] で紹介された $t, t^{\gamma}, \exp(\gamma t) - 1$ などがよく用いられ ている. これらの形状関数を解析者がトライ&エラー によりベストな関数を決定するため、形状関数の妥当 性に関しては研究もあまりされていない. そこで、本 研究の 2 つ目の提案として「形状関数の経験的推定法」 について述べる.

2 提案モデル・手法

2.1 PIG 劣化モデル

Powered Inverse Gaussian (PIG) 分布は [3] で提案 された確率分布である. PIG 分布は対数正規分布など も包含している.

一方, n 個の観測時間 $t_0 = 0 < t_1 < \cdots < t_n$ が得られたもとで,次の性質を持つ確率過程 $\{Y(t)|t \ge 0\}$ を PIG 劣化モデルとする.

- Y(0) = 0 a.s.
- $Y(t_i) Y(t_{i-1})$ (i = 1, ..., n) は独立である
- $Y(t_i) Y(t_{i-1}) \sim$ $PIG(\mu \Delta \Lambda(t_{i-1}, t_i), \sigma(\Delta \Lambda(t_{i-1}, t_i))^2, \alpha)$

2.2 PGIG 劣化モデル

Powered Generalized Inverse Gaussian (PGIG) 分 布は GIG 分布を拡張した分布であり, [5] の中でも示 されている, PGIG 分布は一般化ガンマ分布なども包 含している.

一方, n 個の観測時間 $t_0 = 0 < t_1 < \cdots < t_n$ が得られたもとで,次の性質を持つ確率過程 $\{Y(t)|t \ge 0\}$ をPGIG 劣化モデルとする.

表 1: レーザーデータにおける AIC

劣化モデル	$\Lambda(t) = t$
Gamma [4]	-135.22
IG [7]	-146.07
GIG [9]	-145.03
PIG (Proposed)	-147.62
PGIG (Proposed)	-145.82

表 2: クラックデータ 1 における AIC

劣化モデル	$\Lambda(t)=t^\gamma$	$\Lambda(t) = e^{\gamma t} - 1$
Gamma [4]	123.39	100.06
IG [7]	105.69	88.99
GIG [9]	105.74	91.20
PIG (Proposed)	99.04	84.36
PGIG (Proposed)	87.96	90.10

- Y(0) = 0 a.s.
- $Y(t_i) Y(t_{i-1})$ (i = 1, ..., n) は独立である
- $Y(t_i) Y(t_{i-1}) \sim$

 $PGIG(\lambda\Delta\Lambda(t_{i-1},t_i),\chi(\Delta\Lambda(t_{i-1},t_i))^2,\psi,\alpha)$

2.3 形状関数推定に用いる手法

データから形状関数を推定するために候補に上がる 手法は様々考えられる.本研究では以下の手法に焦点 を絞り評価を行った.

- ガウス過程回帰 (以降, GPR)
- 3 次平滑化スプライン (以降, CSS)
- 3 次多項式回帰 (以降, CPR)

これらの手法を取り上げた理由, 推定手順, ハイパー パラメータの設定は本論に記載している.

3 実データによる適合度評価

実データとして,レーザーデータ [6],クラックデー タ1[11],クラックデータ 2[6],クラックデータ 3[8] の 4 種類のデータを用いた.使用する劣化データはどれも データ数が少なく,汎化性能の評価を行えないと判断 し適合度のみを評価する.

表 3: クラックデータ 2 における AIC

劣化モデル	$\Lambda(t) = t^{\gamma}$	$\Lambda(t) = e^{\gamma t} - 1$
Gamma [4]	-1156.33	-1194.46
IG [7]	-1166.85	-1202.12
GIG $[9]$	-1164.13	-1196.16
PIG (Proposed)	-1165.60	-1201.18
PGIG (Proposed)	-1179.40	-1225.07

3.1 PIG, PGIG 劣化モデルの結果

比較するモデルとして Gamma[4], IG[7], GIG[9] 劣 化モデルを取り上げ, PIG, PGIG 劣化モデルとの比 較を行なった.評価指標として AIC を用いてモデルの 評価を行う. 各データで使用した形状関数は過去の研 究に基づいて使用している.

表1よりレーザーデータにおいて AIC では PIG 劣 化モデルが最良であり,表2からクラックデータ1に おいて $\Lambda(t) = t^{\gamma}$ では PGIG 劣化モデルが, $\Lambda(t) = \exp(\gamma t) - 1$ では PIG 劣化モデルが AIC の観点から最 も良い結果となった.次に,表3,4からクラックデータ 2.3 ではどちらの形状関数の場合も PGIG 劣化モデル が AIC としては最も良くなった.

これらの結果から,PGIG 劣化モデルは AIC の観点 では多くのデータに対して従来の劣化モデルよりも良 い適合結果を示すことがわかる.また,PIG 劣化モデル は PGIG 劣化モデルとの比較では多くの場合 AIC で劣 るが,一部のデータでは PGIG 劣化モデル以上の AIC を示した.

3.2 形状関数の比較

提案した形状関数推定法により推定した形状関数と 従来の形状関数の性能を IG 劣化モデルと Gamma 劣 化モデルに当てはめ比較を行う.ここでは評価指標と して対数尤度 (Log-Likelihood; LL) を使用した.

IG 劣化モデルにおける形状関数ごとの対数尤度の結 果を表 5 に示す.ここで、 $\hat{\Lambda}^1(t), \hat{\Lambda}^2(t), \hat{\Lambda}^3(t)$ はそれぞ れ $\Lambda(t) = t, t^{\gamma}, \exp(\gamma t) - 1$ において推定した形状関数,

表 4: クラックデータ 3 における AIC

	,	. ,
劣化モデル	$\Lambda(t)=t^\gamma$	$\Lambda(t) = e^{\gamma t} - 1$
Gamma [4]	-429.83	-429.92
IG $[7]$	-436.21	-436.40
GIG $[9]$	-434.44	-434.62
PIG (Proposed)	-436.48	-436.66
PGIG (Proposed)	-448.82	-453.45

表 5: IG 劣化モデルでの各形状関数の対数尤度

形状関数	Laser	Crack1	Crack2	Crack3
$\hat{\Lambda}^1(t)$	75.03	-101.73	540.33	221.06
$\hat{\Lambda}^2(t)$	75.04	-49.85	586.42	221.11
$\hat{\Lambda}^3(t)$	75.03	-41.49	603.06	221.20
$\hat{\Lambda}^{\bar{G}}(t)$	74.85	-46.91	596.26	220.90
$\hat{\Lambda}^{P}(t)$	74.89	-47.80	596.90	221.56
$\hat{\Lambda}^{S}(t)$	77.79	-45.18	599.19	225.74

表 6: Gamma 劣化モデルでの各形状関数の対数尤度

形状関数	Laser	Crack1	Crack2	Crack3
$\hat{\Lambda}^1(t)$	69.61	-111.15	529.49	217.89
$\hat{\Lambda}^2(t)$	69.62	-58.69	581.17	217.91
$\hat{\Lambda}^3(t)$	69.61	-47.03	600.23	217.96
$\hat{\Lambda}^{\bar{G}}(t)$	69.38	-46.73	599.00	217.80
$\hat{\Lambda}^{P}(t)$	69.42	-48.22	598.93	218.31
$\hat{\Lambda}^{S}(t)$	72.99	-46.09	601.27	221.91

 $\hat{\Lambda}^{G}(t), \hat{\Lambda}^{P}(t), \hat{\Lambda}^{S}(t)$ はそれぞれ GPR, CPR, CSS に よって推定した形状関数を示している.また,表中の Laser はレーザーデータ, Crack1 はクラックデータ 1, Crack2 はクラックデータ 2, Crack3 はクラックデータ 3 を指している.表 5 から,レーザーデータとクラッ クデータ 3 では CSS によって推定した形状関数が,ク ラックデータ 1,2 では $\exp(\gamma t) - 1$ の形状関数が対数尤 度として最も良くなった.

次に, Gamma 劣化モデルにおける形状関数ごとの 対数尤度の結果を表 6 に示す.全てのデータセットに おいて CSS が最も対数尤度が高い結果となった.

表 4,5 ともに CSS が高い性能を上げているが, GPR, CPR も既存の形状関数と同等もしくは同等以上の結果 を示している.このことから提案した推定手法を使うこ とで従来のような形状関数の関数形を選択せずとも従来 以上の性能を上げることがわかる.表 4.3.1, 4.3.2 ともに CSS が特に高いパフォーマンスを上げているが, GPR, CPR も既存の形状関数と同等もしくは同等以上の結果 を示している.このことから提案した推定手法を使う ことで従来の形状関数である $\Lambda(t) = t, t^{\gamma}, \exp(\gamma t) - 1$ の中から関数を選択せずとも同等以上のパフォーマン スを上げれることがわかる.

4 シミュレーション

4.1 PIG, PGIG 劣化モデルの推定精度

PIG, PGIG 劣化モデル従来の劣化モデルよりパラ メータ数が多く推定精度が悪くなると考えられる. そ のため, IG, GIG, PIG, PGIG 劣化モデルの推定精度を 比較を行う. 各劣化モデルで 10,000 回分のシミュレー ションを行い, その推定値の Bias, MSE などを求めて 推定精度を評価する. 結果としては, PIG 劣化モデル は IG,GIG 劣化モデルと比べ推定精度はあまり変わら なかったが, PGIG 劣化モデルは異常な推定値が出や すいためサンプル数を多く確保する必要がある. 具体 的なシミュレーションの条件, 手順, 結果は本論を参 照されたい.

4.2 形状関数ごとの予測精度の比較

既存の形状関数と提案した推定手法から推定した形 状関数の予測精度の比較を IG 劣化モデルと Gamma 劣 化モデルのシミュレーションデータを用いて行う.各 形状関数ごとにシミュレーションを 1000 回行い,1シ ミュレーションごとのユニット(サンプル)数 n は 25, データの観測時間は $t = 0.5, \ldots, 10 \text{ or } 0.5$ 刻みとし,t =11,12 における予測を行い,評価指標として MSE を用 いて予測精度を評価する.シミュレーションデータを 発生させる際,真の形状関数として以下の 4 つを使う.

$$\Lambda_{s_1}(t) = at + bt^2 + ct^3 \tag{1}$$

$$\Lambda_{s_2}(t) = \exp(ct^b) - 1 \tag{2}$$

$$\Lambda_{s_3}(t) = \log(1+t) \tag{3}$$

$$\Lambda_{s_4}(t) = K\left(\frac{1}{1+be^{-ct}} - \frac{1}{1+b}\right)$$
(4)

これら真の形状関数のパラメータ値は本論の表 5.2.1, 表 5.2.2 の中に記載している.

増分が従う真の分布を IG 劣化モデルの場合は, $Y(t) - Y(s) \sim IG(0.1\Delta\Lambda_s(s,t), (\Delta\Lambda_s(s,t))^2)$ と し, Gamma 劣化モデルの場合は $Y(t) - Y(s) \sim$ $Gamma(\Delta\Lambda_s(s,t),1)$ としてシミュレーション データを発生させる. $\Lambda_s(t)$ には,上で定義した $\Lambda_{s_1}(t), \dots, \Lambda_{s_4}(t)$ のいずれかが用いられる.

これらの条件の下で求めた結果の一部が表 7 である. 結果が多いため抄録では参考として IG 劣化モデルにお ける $\Lambda_{s_2}(t)$ の場合の結果のみを示す.その他の結果は 本論を参照されたい.

結果の要約としては、 $\Lambda_{s_1}(t)$ の時は既存の形状関数 $\Lambda(t) = t^{\gamma}$ が最もよくなっていたが、それ以外の

表 7: IG 劣化モデルのシミュレーションにおける各形 状関数の *t* = 11,12 の MSE の平均

$n = 25, \Lambda_{s_2}(t) = \exp(0.01t^2) - 1$			
形状関数	MSE(t = 11)	MSE(t = 12)	
$\hat{\Lambda}^1(t)$	2.80×10^{-3}	1.49×10^{-2}	
$\hat{\Lambda}^2(t)$	4.64×10^4	2.06×10^5	
$\hat{\Lambda}^3(t)$	5.02×10^5	3.06×10^6	
$\hat{\Lambda}^{\bar{G}}(t)$	$7.39 imes10^{-4}$	5.68×10^{-3}	
$\hat{\Lambda}^{P}(t)$	9.18×10^{-4}	8.42×10^{-3}	
$\hat{\Lambda}^{S}(t)$	7.57×10^{-4}	$5.45 imes \mathbf{10^{-3}}$	

 $\Lambda_{s_2}(t), \Lambda_{s_3}(t), \Lambda_{s_4}(t)$ では,推定した形状関数を使用した方が結果は良くなった.

5 結論と今後の課題

本研究では、一つ目の提案として IG 分布および GIG 分布に従う確率変数をべき乗変換して得られる一般化分 布である PIG 分布、PGIG 分布の 2 つの分布に基づく 劣化モデルについて提案した.提案モデルと既存のモデ ルを 4 つの実データによって比較を行い、PIG、PGIG 劣化モデルは良い当てはまりを示した.また、提案モ デルの推定精度について検証し、特に PGIG 劣化モデ ルはパラメータが多く推定が不安定になりがちなので、 サンプル数を多く必要なことに留意すべきである.

二つ目の提案として形状関数を経験的に推定する方 法について提案した.推定手法にはガウス過程回帰,多 項式回帰,3次平滑化スプラインを採用した.第4章 では,実データを使用しIG劣化モデル,Gamma劣化 モデルそれぞれにおいて既存の形状関数と3つの手法 で推定した形状関数の適合度の比較を行い,第5章で はシミュレーションデータを用いて予測精度を測った. 推定手法の中では,第4章では特に3次平滑化スプラ インがよい結果を示したものの,第4,5章ともにどの 形状関数推定手法においても過去の形状関数と同等も しくは同等以上の適合度と汎化性能となり,従来のよ うな形状関数の選択の議論をせずとも高い性能を出せ ることを示せた.

本研究では4つの実際の劣化データを使用したが、ど れも古いデータセットもしくはサンプル数の少ないデー タセットであったため新しいデータセットにも当ては まるか検証が必要である.

PGIG 分布に関しては [5] で簡単に言及されているの みで深くは研究されていないため, PGIG 分布の統計的 性質について研究する余地があるだろう.また, PIG, PGIG 劣化モデルは高い適合度を示したものの汎化性 能の評価は本研究では行っておらず,実学上有効であ るかは示せていないので,これらの提案モデルの汎化 性能を評価する必要性がある.

劣化モデルにおける形状関数の推定に関しては, Wiener 劣化モデルでの検証も必要である.また,ガ ウス過程回帰の平均関数に3次平滑化スプラインを用 いて推定することで,より性能の高いを上げることが できると考えられる.

参考文献

- Doksum, K. A. and Hóyland, A. (1992). "Models for variable stress accelerated life testing experiments based on Wiener process and the inverse Gaussian distribution". *Technometrics*, Vol.34, pp.74-82
- [2] Fushihara, T., and Nagatsuka, H. (2022). "New Stochastic Degradation Models Based on the Family of Powered Inverse Gaussian Distributions". *Total Quality Science*, (to appear).
- [3] Iwase, K., and Hirano, K. (1990), "Power inverse Gaussian distribution and its applications", *Applied Statistics*, Vol.19, pp.163-176
- [4] Bagdonavičius, V. and Nikulin, M.S. (2000), "Estimation in Degradation Models with Explanatory Variables", *Lifetime Data Analysis*, Vol.7, pp.85-103
- [5] Masuda, H. (2002), "Analysis of GIG distribution and GH distribution", *Statistical Mathematics*, Vol.50, pp.165-199
- [6] Meeker, W. Q. and Escobar, L. A. (1998), "Statistical Methods for Reliability Data", John Wiley & Sons, New York
- [7] Peng, C. Y. (2015), "Inverse Gaussian Processes with Random Effects and Explanatory Variables for Degradation Data", *Technometrics*, Vol.57, pp.100-111
- [8] Rodríguez Picón, L. A., and Rodríguez Picón, A. P., et al (2017), "Degradation modeling based on gamma process models with random effects", *Communications* in Statistics - Simulation and Computation, Vol.47, pp.1796-1810
- [9] Tamaru, L. and Nagatsuka, H. (2019), "On a Stochastic Degradation Model based on the Generalized Inverse Gaussian distribution", Asian Journal of Management Science and Applications, Vol.4, pp.49-58
- [10] Wu, S. J. and Shao, J. (1999). Reliability analysis using the least squares method in nonlinear mixed-effect degradation models. *Statistica Sinica*, Vol.9, pp.855-877.
- [11] Wu, W. F. and Ni, C. C. (2003), "A Study of Stochastic Fatigue Crack Growth Modeling Through Experimental Data", *Probabilistic Engineering Mechanics*, Vol.18, pp.107-118